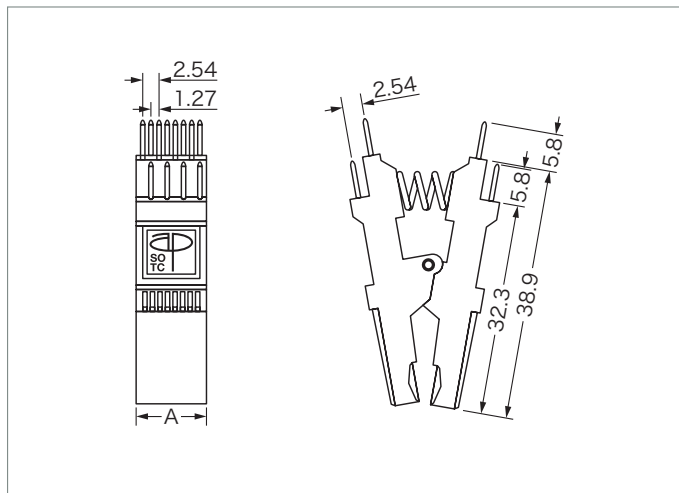
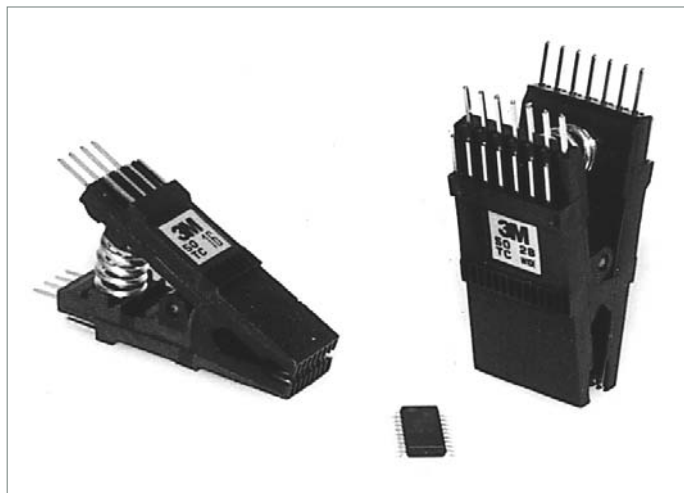


SOP IC テストクリップ

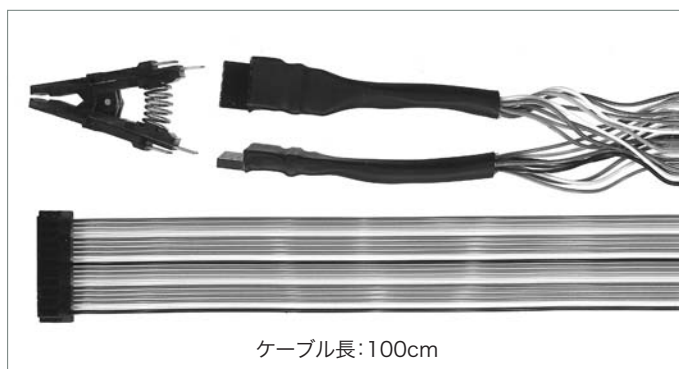


- SO (Small Outline) パッケージのテスト用に開発されたテストクリップ。
- 1.27mmピッチのSOICがテストプローブに素早く簡単に接続が出来、ICピン間のショートやプリント基板上の部品破損の心配が無い。
- テストクリップの上部は0.635mm角ピンで2.54mmピッチなので、メスソケットコネクタも簡単に接続出来ます。

仕様 本体: ガラス封入ポリエステル、黒色 コンタクト: 銅合金、又は金メッキ

SOPテストクリップ用ロジカルコネクションジャンパー

- SOPテストクリップの上部のピンに直接接続できるジャンパーケーブルで、テスト作業が効率的に行なえます。
- 2種類から選択
 - (1) 他端に2列のコネクタが付いているタイプ。
 - (2) 他端がオープンになっており、任意に端子加工が出来るタイプ。



SOP IC テストクリップ 型番	ピン数	適合デバイスサイズ	コンタクト部	A	SOPテストクリップ用ロジカルコネクションジャンパー 型番	
					コネクタ無し	コネクタ付
SOTC-8	8	リードピッチ: 1.27 幅: 5.72	銅合金	11.2	SOLC-8	SOLC-8 SKT
SOTC-8G			金メッキ			
SOTC-14	14		銅合金	9.9	SOLC-14	SOLC-14 SKT
SOTC-14G			金メッキ			
SOTC-16	16		銅合金	11.2	SOLC-16	SOLC-16 SKT
SOTC-16G			金メッキ			
SOTC-16LSI	16 ワイド		銅合金	11.2	SOLC-16	SOLC-16 SKT
SOTC-16LSIG			金メッキ			
SOTC-18	18	銅合金	12.5	SOLC-18	SOLC-18 SKT	
SOTC-18G		金メッキ				
SOTC-20	20	リードピッチ: 1.27 幅: 7.62	銅合金	13.7	SOLC-20	SOLC-20 SKT
SOTC-20G		金メッキ				
SOTC-24	24	銅合金	16.3	SOLC-24	SOLC-24 SKT	
SOTC-24G		金メッキ				
SOTC-28	28	銅合金	18.8	SOLC-28	SOLC-28 SKT	
SOTC-28G		金メッキ				

- AP社SOICテストクリップは、パッケージとほぼ同一幅で設計されていますので、ICを2個以上隣接して同時に測定する場合でも、スペースを気にせず使用出来ます。

注意 テストクリップ上部のピンヘッダーを押さえて開きますと、ピンが曲がりジャンパーケーブルを使用出来なくなりますのでご注意ください。